

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55 °C ~ 85 °C (注1)	保存温度範囲	-10 °C ~ 60 °C (注2)	
	電 圧	AC 200 V	使用湿度範囲	相対湿度 85%以下	
	電 流	1 A	保存湿度範囲	(但し結露の無いこと)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外觀, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	15 mΩ以下	○	-
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	-
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。		○	-
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2°C, 湿度 90~95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上	○	-
	温度サイクル 	温度 -55 → +15 ~ +35 → +125 → +15 ~ +35 °C 時間 30 → 10~15 → 30 → 10~15 分 を 5サイクル試験する。	③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。	① 接触抵抗: 15 mΩ以下	○	-
	硫化水素	濃度 3 ppm, 120 時間放置する。	② はなはだしい腐食がないこと。	○	-
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5°C 浸せき時間 10±1秒	外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。	○	-
		はんだこての場合: こて温度 360 °C はんだ付け時間 5 秒以内		○	-
はんだ付け性	はんだ温度 245±3 °C, 浸せき時間 2 秒間 のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	-	
△の数	訂正記事		設計	検図	年月日
 1	DIS-F-00009794		YS. NARA	HT. YAMAGUCHI	20210616
備考			承認	HT. YAMAGUCHI	20181210
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	HT. YAMAGUCHI	20181210
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	TS. OONO	20181207
試験規格の記載のない試験方法は MIL-STD-202 を適用している。			製 図	TS. HORI	20181207
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番 SLC-386215-00-00		
	製品規格表		製品名		HIF3B*-*PA-2. 54DS (63)
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		 1/1